

**ПРОГРАММА**  
**Международной научно-технической конференции**  
**«Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной**  
**аппаратуры надежной электронной компонентной базой»**  
**«СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКБ-2017»**

5 – 7 апреля 2017 г.

г. Санкт-Петербург

**05.04.17**

	8 <sup>30</sup> – 10 <sup>00</sup>	Регистрация участников конференции.
	10 <sup>00</sup> – 10 <sup>10</sup>	<i>Приветственное слово Генерального директора АО «РНИИ «Электронстандарт» <b>Льва Анатольевича Еришова</b></i>
	10 <sup>10</sup> – 10 <sup>20</sup>	<i>Приветственное слово Вице-губернатора Санкт-Петербурга <b>Сергея Николаевича Мовчана</b></i>

**ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ**

1.	10 <sup>20</sup> – 10 <sup>50</sup>	<i>Выступление Заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, к.э.н. <b>Олега Ивановича Бочкарева</b></i>
2.	10 <sup>50</sup> – 11 <sup>20</sup>	<i>Выступление Заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, к.т.н. <b>Павла Павловича Куцько</b></i>
3.	11 <sup>20</sup> – 11 <sup>50</sup>	<i>Механизмы формирования единого информационного пространства в Радиоэлектронной отрасли. А.В. Брыкин. Докладчик: Заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Российская электроника», д.э.н. <b>Арсений Валерьевич Брыкин</b></i>
4.	11 <sup>50</sup> – 12 <sup>00</sup>	<i>Обеспечение современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой. Д.А. Строганов. Докладчик: Ведущий специалист отдела Государственной корпорации «Роскосмос», к.т.н. <b>Дмитрий Анатольевич Строганов</b></i>
5.	12 <sup>00</sup> – 12 <sup>30</sup>	<i>Научно-организационный замысел разработки комплекса стандартов «Климат-8». В.В. Алексеев. Докладчик: Директор ФГУП «МНИИРИП», к.т.н. <b>Виктор Валентинович Алексеев</b></i>
6.	12 <sup>30</sup> – 13 <sup>00</sup>	<i>Социально-ориентированные технологии превосходства. В.В. Лучинин. Докладчик: Профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», заведующий кафедры микро- и наноэлектроники, директор ЦМИД, д.т.н. <b>Виктор Викторович Лучинин</b></i>
	13 <sup>00</sup> – 14 <sup>30</sup>	<b>Обед.</b>
7.	14 <sup>30</sup> – 14 <sup>45</sup>	<i>Уполномоченная организация государственного заказчика ЭКБ в области рассмотрения и согласования программ и методик сертификационных испытаний. Р.Г. Левин. Докладчик: Первый заместитель генерального директора АО «РНИИ «Электронстандарт», к.ф.-м.н. <b>Роман Григорьевич Левин</b></i>

8.	14 <sup>45</sup> – 15 <sup>00</sup>	<p>Порядок выполнения условий применения ЭКБ ИП в системах, комплексах и образцах вооружения, военной и специальной техники. Особенности сертификационной деятельности в области ЭКБ. С.Б. Подъяпольский.</p> <p><i>Докладчик: Начальник управления ФГУП «МНИИРИП», к.т.н. <b>Сергей Борисович Подъяпольский</b></i></p>
9.	15 <sup>00</sup> – 15 <sup>20</sup>	<p>Выявление контрафактных электронных компонентов методами физико-технического анализа. К.А. Венедиктов, А.А. Голубев, И.В. Емельянова, С.Э. Малютенкова, А.В. Лактионов, М.И. Звягина, Ю.А. Ямщиков.</p> <p><i>Докладчик: И.о. руководителя испытательного центра АО «РНИИ «Электронстандарт» <b>Андрей Владимирович Лактионов</b></i></p>
10.	15 <sup>20</sup> – 15 <sup>40</sup>	<p>Машино-считываемая высокозащищенная маркировка, как средство противодействия незаконному обороту контрафактной ЭКБ. В.А. Елохин, В.А. Котлиб.</p> <p><i>Докладчик: Генеральный директор АО «Научные приборы», к.ф.-м.н. <b>Владимир Александрович Елохин</b></i></p>
11.	15 <sup>40</sup> – 16 <sup>00</sup>	<p>Работы головной организации Роскосмоса по ЭКБ в 2016-2017 гг. В.Б. Стешенко.</p> <p><i>Докладчик: Заместитель генерального конструктора ОАО «Российские космические системы», к.т.н. <b>Владимир Борисович Стешенко</b></i></p>
12.	16 <sup>00</sup> – 16 <sup>20</sup>	<p>Вопросы проведения сертификации изделий электронной компонентной базы. Ю.В. Максимов, Р.А. Матюшев.</p> <p><i>Докладчик: Заместитель генерального директора по качеству АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева <b>Юрий Викторович Максимов</b></i></p>
13.	16 <sup>20</sup> – 16 <sup>40</sup>	<p>Системные вопросы испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства для обеспечения высоких сроков активного существования РЭА. В.С. Анашин, А.С. Бычков, А.Е. Козюков.</p> <p><i>Докладчик: Заместитель руководителя Филиала АО «ОРКК» - «НИИ КП», к.т.н. <b>Василий Сергеевич Анашин</b></i></p>
14.	16 <sup>40</sup> – 17 <sup>00</sup>	<p>Состояние и развитие системы экспертизы радиационной стойкости электронной компонентной базы. А.Ю. Никифоров, В.А. Телец, О.А. Калашников, Д.В. Бойченко, А.В. Уланова, Л.Н. Кессаринский, Г.В. Чуков.</p> <p><i>Докладчик: Заместитель директора ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, д.т.н., проф. <b>Никифоров Александр Юрьевич</b></i></p>
15.	17 <sup>00</sup> – 17 <sup>20</sup>	<p>Особенности технологий и элементной базы современных СБИС для космической аппаратуры. Н.А. Шелепин.</p> <p><i>Докладчик: Первый заместитель генерального директора АО «НИИМЭ», д.т.н. <b>Николай Алексеевич Шелепин</b></i></p>
16.	17 <sup>20</sup> – 17 <sup>40</sup>	<p>Тенденции и проблемные вопросы создания радиационно-стойкой электронной компонентной базы твердотельной СВЧ электроники. В.В. Елесин<sup>1</sup>, Г.Н. Назарова<sup>2</sup>, А.Ю. Никифоров<sup>1</sup>, Д.И. Сотсков<sup>1</sup>, В.А. Телец<sup>1</sup>, Н.А. Усачёв<sup>1</sup>, Г.В. Чуков<sup>2</sup>, И.Н. Кабанов<sup>3</sup>, А.Н. Щепанов<sup>3</sup> (<sup>1</sup>НИЯУ «МИФИ», <sup>2</sup>АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>3</sup>ФГУП «МНИИРИП»).</p> <p><i>Докладчик: Заместитель руководителя НТК ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, к.т.н. <b>Усачев Николай Александрович</b></i></p>

17.	17 <sup>40</sup> – 18 <sup>00</sup>	Основные подходы к решению задач обеспечения СВЧ ЭКБ аппаратуры для отечественных применений. Е.М. Савченко. <i>Докладчик: Начальник отделения № 8 «Центр проектирования» АО «НПП «Пульсар» Евгений Матвеевич Савченко</i>
18.	18 <sup>00</sup> – 18 <sup>20</sup>	Возможности сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа в анализе состава и микроструктуры различных материалов. Результаты исследований многослойного строения полупроводниковых приборов методом ионного и плазменного травления поверхности с помощью двухлучевых микроскопов от компании TESCAN. А.А. Кудрявцев, М.В. Лукашева. <i>Докладчик: Специалист аналитик ООО «ТЕСКАН», к.ф.-м.н. Андрей Александрович Кудрявцев</i>

**06.04.17**

19.	9 <sup>00</sup> – 9 <sup>15</sup>	Метрологическое обеспечение современного электронного производства на основе интегрирования измерительных и технологических задач. А.С. Кривов. <i>Докладчик: Заместитель директора АО «НПФ «Диполь», д.т.н., проф. Анатолий Сергеевич Кривов</i>
20.	9 <sup>15</sup> – 9 <sup>30</sup>	Маршрут проектирования специализированных микросхем на БК с применением САПР «Ковчег». В.Г. Сницар. <i>Докладчик: Заместитель директора по науке ФГУП «НПК «Технологический центр «МИЭТ» Валерий Григорьевич Сницар</i>
21.	9 <sup>30</sup> – 9 <sup>45</sup>	Перспективная ЭКБ холдинга «ИНТЕГРАЛ» для применения в современной радиоэлектронной аппаратуре. С.В. Шведов. <i>Докладчик: Директор ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» Сергей Васильевич Шведов</i>
22.	9 <sup>45</sup> – 10 <sup>00</sup>	Новые технологические возможности АО «ЗПП». А.Н. Илюткин. <i>Докладчик: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «ЗПП» Антон Николаевич Илюткин</i>
23.	10 <sup>00</sup> – 10 <sup>15</sup>	Многослойные керамические конденсаторы для разрабатываемой и модернизируемой ВВСТ. Е.В. Бокарева. <i>Докладчик: Начальник лаборатории керамических конденсаторов АО «НИИ «Гириконд» Елена Валерьевна Бокарева</i>
24.	10 <sup>15</sup> – 10 <sup>30</sup>	Импортозамещающие разработки монолитных интегральных схем и модулей СВЧ для космической аппаратуры. Е.М. Савченко, М.В. Гладких, А.В. Телец. <i>Докладчик: Начальник лаборатории ЦП-21 отделения №8 «ЦП» АО «НПП «Пульсар» Михаил Викторович Гладких</i>
25.	10 <sup>30</sup> – 10 <sup>45</sup>	Линия сборки ИС АО «РНИИ «Электронстандарт». П.С. Кувалкин, В.Г. Малинин, Р.Г. Левин. <i>Докладчик: Начальник производственного отдела АО «РНИИ «Электронстандарт» Павел Сергеевич Кувалкин</i>
26.	10 <sup>45</sup> – 11 <sup>00</sup>	Анализ причин отказа сложных импортных радиокомпонентов и модулей. К.А. Молчанов, И.В. Емельянова, С.Э. Малютенкова, А.С. Модзалевский. <i>Докладчик: Инженер 1 категории АО «РНИИ «Электронстандарт» Константин Александрович Молчанов</i>

27.	11 <sup>00</sup> – 11 <sup>15</sup>	Методические особенности выявления контрафактных микросхем иностранного производства на основе кортежей идентификаторов. Н.А. Конькова, А.В. Семенов, Е.Н. Степанов, В.Н. Федорец. <i>Докладчик: Начальник лаборатории ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, к.т.н. Антон Валерьевич Семенов</i>
28.	11 <sup>15</sup> – 11 <sup>30</sup>	Результаты анализа эксплуатационных отказов электронной компонентной базы в АО «Российские космические системы» в 2016 г. И.Ю. Булаев, А.А. Сашов. <i>Докладчик: Начальник группы Научного центра сертификации элементов и оборудования АО «Российские космические системы» Иван Юрьевич Булаев</i>
29.	11 <sup>30</sup> – 11 <sup>45</sup>	Новые возможности исследований и прогнозного контроля радиационной стойкости ЭКБ в процессе разработки и производства Ю.М. Московская, А.Ю. Никифоров, Д.В. Бобровский, Д.В. Бойченко. <i>Докладчик: Руководитель обособленного подразделения «Зеленоград» АО «ЭНПО СПЭЛС» Юлия Марковна Московская</i>
30.	11 <sup>45</sup> – 12 <sup>00</sup>	Радиационная стойкость различных классов оптических изделий: доминирующие эффекты, методики испытаний и основные результаты. А.В. Уланова, М.Е. Черняк, А.А. Печенкин, А.Г. Петров, А.Ю. Никифоров, А.И. Чумаков. <i>Докладчик: Руководитель НТК АО «ЭНПО СПЭЛС», к.т.н. Анастасия Владиславовна Уланова</i>
31.	12 <sup>00</sup> – 12 <sup>15</sup>	Катастрофические отказы ЭКБ от ТЗЧ: основные эффекты, особенности испытаний и оценки соответствия изделий требованиям ТЗ. А.В. Яненко, А.Б. Боруздина, А.И. Чумаков, А.А. Печенкин, Д.В. Бобровский. <i>Докладчик: Руководитель группы ИЭПЭ НИЯУ «МИФИ», к.т.н. Анна Борисовна Боруздина</i>
32.	12 <sup>15</sup> – 12 <sup>30</sup>	Особенности поведения и оценки радиационной стойкости аналоговых полузаказных СБИС. Л.Н.Кессаринский <sup>1</sup> , А.Я. Борисов <sup>1</sup> , Д.В.Бойченко <sup>1</sup> , Ю.М.Московская <sup>1</sup> , В.В.Эннс <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> АО «ЭНПО СПЭЛС», <sup>2</sup> ДЦ «Союз») <i>Докладчик: Руководитель НТК АО «ЭНПО СПЭЛС», к.т.н. Леонид Николаевич Кессаринский</i>
33.	12 <sup>30</sup> – 12 <sup>45</sup>	Исследование характеристик пучков ионов на испытательных стендах по контролю стойкости ЭКБ к воздействию ионизирующего излучения и их вариации при различных плотностях потоков и энергиях. В.С. Анашин, А.С. Бычков, А.Е. Козюков. <i>Докладчик: Инженер Филиала АО «ОРКК» - «НИИ КП» Антон Сергеевич Бычков</i>
34.	12 <sup>45</sup> – 13 <sup>00</sup>	Разработки и исследовательские работы АО «НИИЭТ» в сфере интегральных микросхем стойких к специальным воздействующим факторам. В.В. Бородовицын, Б.И. Степанский, А.И. Яньков. <i>Докладчик: Начальник отдела маркетинга и сбыта АО «НИИЭТ» Владислав Викторович Бородовицын</i>
13 <sup>00</sup> – 14 <sup>30</sup>		<b>Обед.</b>
35.	13 <sup>00</sup> – 13 <sup>15</sup>	Отработка методики бесконтактного нагрева кристаллов ЭКБ при испытаниях на стойкость к одиночным радиационным эффектам. Е.В. Митин <sup>1</sup> , Е.Н. Некрасова <sup>1</sup> , В.С. Анашин <sup>2</sup> , А.Е. Козюков <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> ООО «НПЦ «Гранат», <sup>2</sup> Филиал ОАО «ОРКК» - «НИИКП») <i>Докладчик: Начальник отдела радиационных и ресурсных испытаний ООО «НПЦ «Гранат» Евгений Викторович Митин</i>

36.	13 <sup>15</sup> – 13 <sup>30</sup>	Справочник «Надежность электронной компонентной базы – 2017». И.В. Архипова, А.В. Батурич, Т.Е. Гудилина, Е.А. Карпова, Р.Г. Левин, И.А. Мельникова, Т.С. Тирронен, И.Н. Иванова. <i>Докладчик: Директор по качеству АО «РНИИ «Электронстандарт»</i> <b>Антон Владимирович Батурич</b>
37.	13 <sup>30</sup> – 13 <sup>45</sup>	Технологические проблемы возникающие при подтверждении соответствия ЭКБ заявленным характеристикам. Оснастка, приспособления, средства измерения и методики. Е.А. Мордкович, А.Ю. Насонов. <i>Докладчик: Технический директор ООО «Остек-Электро»</i> <b>Насонов Андрей Юрьевич</b>
38.	13 <sup>45</sup> – 14 <sup>00</sup>	Модульные системы тестирования с открытой архитектурой на базе новейшей российской разработки – стандарта RXI. Е.В. Турлаев. <i>Докладчик: Руководитель СПП ООО «ФОРМ»</i> <b>Турлаев Евгений Викторович</b>
39.	14 <sup>00</sup> – 14 <sup>15</sup>	Оборудование и технологии группы компаний «weisstechnik®» для производства ЭКБ. П.О. Бономорский <i>Докладчик: Технический директор-Главный конструктор АО «ГК «Электронинвест»</i> <b>Павел Олегович Бономорский</b>
40.	14 <sup>15</sup> – 14 <sup>30</sup>	Использование синергетического эффекта для улучшения радиационных характеристик промышленной аналоговой ЭКБ и организации мелкосерийного производства. А.А. Лебедев <sup>1</sup> , В.П. Тарасов <sup>2</sup> ( <sup>1</sup> НИЯУ МИФИ, <sup>2</sup> МТУ МИРЭА). <i>Докладчик: Доцент НИЯУ «МИФИ», к.т.н.</i> <b>Анатолий Алексеевич Лебедев</b>
41.	14 <sup>30</sup> – 14 <sup>45</sup>	Алгоритм восстановления содержимого памяти микроконтроллера при ограничении доступа. А.О. Гасников, С.Б. Калинин, В.В. Лучинин. <i>Докладчик: Начальник лаборатории Центра микротехнологии и диагностики, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»</i> <b>Гасников Алексей Олегович</b>
42.	14 <sup>45</sup> – 15 <sup>00</sup>	Тополого-схемотехнический анализ ПЛИС с проектной нормой 28 нм. А.О. Гасников, М.И. Ершов, В.В. Трушлякова. <i>Докладчик: Инженер Центра микротехнологии и диагностики, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»</i> <b>Михаил Игоревич Ершов</b>
15 <sup>00</sup> – 15 <sup>15</sup>		<b>Перерыв.</b>
15 <sup>15</sup> – 18 <sup>00</sup>		<b>Обсуждение докладов.</b>

**5-6.04.176**

### СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

43.	Доступная ЭКБ ИП для бортовой и наземной РЭА. И.Л. Бурцев, Т.Ю. Мамаева, А.К. Рыжаков, В.Я. Яцук. <i>Докладчики:</i> <i>Старший инженер-консультант отдела дистрибуции электронных компонентов ООО «ЭФО»</i> <b>Татьяна Юрьевна Мамаева (+7911-2188320)</b> <i>Руководитель направления АО «Восток»</i> <b>Игорь Леонидович Бурцев (+7921-7651580)</b>
44.	Контроль бортовых сетей электропитания. Радиационно-стойкие источники вторичного электропитания Космического назначения. А.Ю. Терез. <i>Докладчик: Инженер ООО «НПЦ «Гранат»</i> <b>Александр Юрьевич Терез (+7904-3332407)</b>

45.	<p>Поставка оборудования для электротермотренировки. А.Н. Аскерко.  <i>Докладчик: Генеральный директор АО «НПЦ «ЭлТест»</i>  <b>Андрей Николаевич Аскерко (+7960-2607180)</b></p>
46.	<p>Оборудование для измерения размеров и контроля плоскостности и толщин пленок в кристалльном производстве. С.И. Воронин  <i>Докладчик: Начальник управления ОАО «КБТЭМ-ОМО»</i>  <b>Сергей Иванович Воронин (+375-17-2260982)</b></p>
47.	<p>Контроль дефектности = Контроль надёжности. В.И. Плебанович  <i>Докладчик: Начальник управления ОАО «КБТЭМ-ОМО»</i>  <b>Владимир Иванович Плебанович (+375-17-3922406)</b></p>
48.	<p>Отечественный радиационно-стойкий контроллер твердотельного накопителя информации для космического применения. Д.И. Воронков, А.В. Руткевич  <i>Докладчик: Генеральный директор ООО «НПП «Цифровые решения»</i>  <b>Руткевич Александр Владимирович (+7495-9782870)</b></p>
49.	<p>Внедрение автоматизации работ с номенклатурой ЭКБ при подборе аналогов.  Рябков М.Е.  <i>Докладчик: Коммерческий директор ООО «Радиотесткомплект»</i>  <b>Рябков Максим Евгеньевич (+7985-7638780)</b></p>